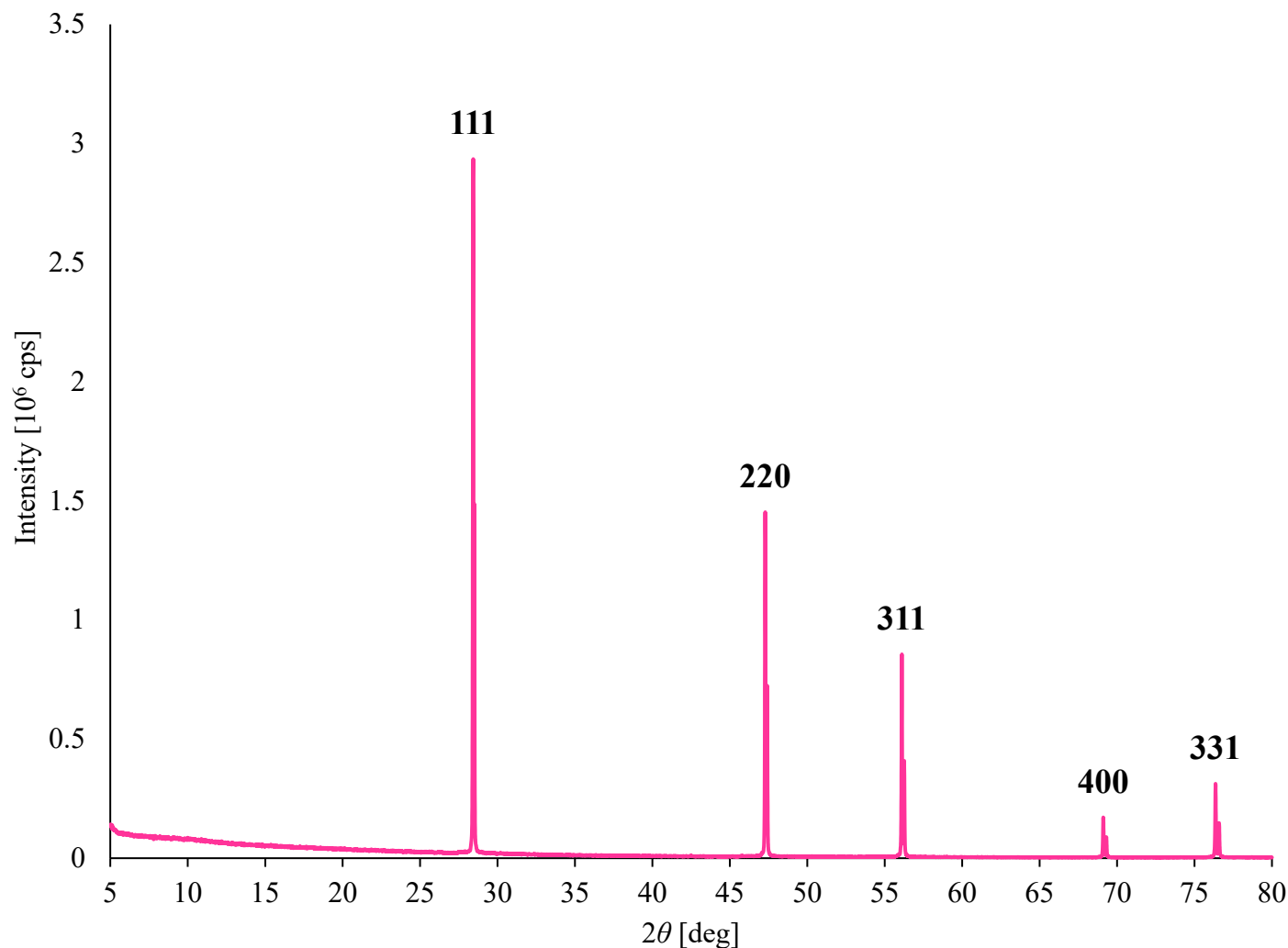


X線回折による調整用シリコン粉末の測定



測定条件

サンプル	X線装置付属調整用Si粉末		
ターゲット元素	Cu		
管電圧	45 kV	管電流	200 mA
入射スリット	½ deg	受光スリット	20.100 mm
スキャン軸	2θ/θ		
スキャン速度	50 degg/min		